A parametrized numerical model to simulate the semiconductor influence of thick film metal oxide gas sensors

March 20, 2020

Dissertation

der Mathematisch – Naturwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)

> vorgelegt von Peter Bonanati aus Mainz am Rhein

> > Tübingen 2020

Tag der mündlichen Prüfung: xx.xx.2020

Dekan: Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel

Berichterstatter: Prof. Dr. Udo Weimar
Berichterstatter: Prof. Dr. Reinhold Fink